

01:03:04

©1994

## СТАТИСТИКА ФЛУКТУАЦИОННЫХ ПРОБОВ ЖИДКОЙ ПРОВОДЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

*И. Н. Алиев*

При превышении порога устойчивости на плоской поверхности проводника в электрическом поле растут волновые искажения, имеющие изначально сколь угодно малые амплитуды, что приводит в конечном счете к диспергированию жидкости — так называемой неустойчивости Френкеля–Тонкса (см., например, [1], с. 54). Считается, что неустойчивость не возникает, если приложенное поле ниже порогового. Но это верно только отчасти: неустойчивость не прорабатывается для возмущений с пренебрежимо малой амплитудой. Однако если последняя конечна и превышает некоторое пороговое значение, то со временем возникает нарастание волнового возмущения, т.е. наблюдается неустойчивость поверхности. Определим характерную зависимость времени ожидания пробоя в зависимости от разности между напряженностями поля порога неустойчивости и приложенного поля. Согласно [1], если отклонение поверхности от равновесия описывается гармоническим законом  $\xi = \xi_0 \cos(kx - \omega t)$  ( $x$  — ось вдоль поверхности), то нормальная составляющая поля вблизи заряженной поверхности имеет вид  $E_z = E_0(1 + k\xi)$ , причем напряженность поля линейно связана с поверхностной плотностью зарядов:  $E_0 = 4\pi\sigma_0$ . Известно, что спектр капиллярных волн в присутствии поля в условиях устойчивости записывается в виде

$$\omega^2 = \frac{k^2}{\rho} \left( \gamma k - \frac{E_z^2}{4\pi} \right)$$

( $\gamma, \rho$  — поверхностное натяжение и плотность жидкости). Заметим, что здесь  $k$  больше некоторого предельного значения  $k_0 \simeq \frac{\pi}{L}$ , что соответствует характерному масштабу зеркала поверхности  $L$ ; причем, если  $k = k_0$ , то  $\omega^2 > 0$ .

Приведенный закон дисперсии описывает волны с бесконечно малой амплитудой. Для волн конечной амплитуды с ростом  $E_z$  возникает ситуация с  $\omega^2 \leq 0$ , т.е. неустойчивость. Из дисперсионного уравнения с учетом условия неустойчивости ( $\omega^2 = 0$ ) для случая  $\alpha = k\xi_0 < 1$  имеем

$\alpha_0 = \frac{1}{2} \left( \frac{\gamma k}{4\pi\sigma_0^2} - 1 \right)$  и при  $\alpha > \alpha_0$  возникает неустойчивость волны с волновым числом  $k$ . Деформация, соответствующая этому  $\alpha$  требует энергии

$$\Delta\varepsilon = \frac{\alpha^2 S}{8k} (\gamma k - 4\pi\sigma_0^2)$$

( $S$  — площадь зеркала невозмущенной поверхности).

Из полученных выражений следует, что  $\Delta\varepsilon \sim \alpha^3$ . Учитывая, что  $\alpha = k\xi$ , убеждаемся, что  $\Delta\varepsilon$  монотонно растет с увеличением  $k$ , причем минимальное значение  $\Delta\varepsilon$  соответствует минимальному  $k = k_0$ , а именно  $\Delta\varepsilon_{\min} = \Delta\varepsilon(k_0)$ .

В условиях термодинамического равновесия вероятность иметь энергию  $\Delta\varepsilon_{\min}$  определяется распределением  $W = A \exp\left(-\frac{\Delta\varepsilon_{\min}}{k_B T}\right)$ ,  $k_B$  — постоянная Больцмана,  $T$  — температура. Поэтому характерное время ожидания возникновения неустойчивости запишется в виде

$$\tau = \tau_0 \exp\left(\frac{\Delta\varepsilon_{\min}}{k_B T}\right)$$

( $\tau_0$  — характерное время движения атомов жидкости вблизи поверхности).

Приведем характерные оценки. Пусть  $L \sim 1$  см,  $S \sim 1$  см<sup>2</sup>,  $\gamma \sim 10 \frac{\text{эрг}}{\text{см}^2}$ ,  $\alpha \sim 10^{-4}$ . Отсюда  $\Delta\varepsilon = 30 k_B T$  и амплитуда  $\xi_0 \sim 1.5 \cdot 10^{-5}$  см, время  $\tau \sim 10^2$  с (для характерных времен  $\tau_0 \sim 10^{-11}$  с).

Легко понять, что распределение вероятностей сохранения устойчивости поверхности в электрическом поле имеет экспоненциальный вид

$$W = \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right),$$

причем  $\tau$  определено выше. Окончательное выражение имеет вид

$$\ln \frac{\tau}{\tau_0} = \frac{1}{8} \alpha^3 \gamma S.$$

Таким образом, по мере приближения напряженности поля к пороговому значению  $\ln \tau$  уменьшается как

$$(E_{\text{пор}} - E)^3.$$

## Список литературы

- [1] *Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М.* Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982. 203 с.

Московский государственный  
технический университет  
им. Н.Э. Баумана

Поступило в Редакцию  
4 января 1994 г.

---